

Amtliche Bekanntmachungen

Herausgegeben im Auftrage des Rektors von der Abteilung 1.1 des Dezernates 1.0
der RWTH Aachen, Templergraben 55, 52056 Aachen

Nr. 993	22.07.2005	Redaktion: Iris Wilkening
S. 7992 - 7994		Telefon: 80-94040

Zweite Ordnung

zur Änderung der Studienordnung

für den Masterstudiengang Materialwissenschaften (Materials Science)

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

Vom 29.06.2005

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW, S. 190) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 (GV. NRW, S. 752) hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) die folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die Studienordnung für den Masterstudiengang Materialwissenschaften (Materials Science) der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen vom 29. August 2003 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 818, S. 5396), zuletzt geändert durch Ordnung vom 14.04.2005 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 973, S. 7752) wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs.3 Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) Oberflächentechnik und Katalyse

Oberflächentechnik I	7	12	2 1/2
Rastersondenmikroskopie	3	5	1 1/2
Katalyse in der Technik	2	3	1 1/2 "

2. In § 11 Abs. 1 werden die Ausführungen zur „Anorganischen Chemie II“ durch folgende Fassung ersetzt:**„Rastersondenmikroskopie**

Überblick Mikroskopie; Einleitung und Geschichte der Rastersondenmikroskopie; Technik der Bildanalyse; Rastertunnelmikroskopie von reinen und adsorbatbedeckten Oberflächen; atomare Manipulation; Rastertunnelspektroskopie; magnetische, dynamische, elektrochemische und variable Temperatur Tunnelmikroskopie; Kontaktkraftmikroskopie; Reibung, Adhäsion und mechanische Eigenschaften; Nicht-Kontakt Kraftmikroskopie; magnetische Kraftmikroskopie.“

3. Anlage 1

In der Anlage 1 wird der Studienverlaufsplan „Oberflächentechnik und Katalyse“ durch beiliegende Fassung ersetzt.

4. Anlage 2

In der Anlage 2 wird im Pflichtteil Vertieferebereiche im Abschnitt „Oberflächentechnik und Katalyse“ die Bezeichnung „Anorganische Chemie II“ durch die Bezeichnung „Rastersondenmikroskopie“ ersetzt.

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik vom 11.05.2005.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 29.06.2005

gez. Rauhut
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Burkhard Rauhut

Anlage 1

Studienplan

Studienverlaufsplan: Oberflächentechnik und Analyse

Der hier angegebene Studienverlaufsplan ist lediglich eine Empfehlung. Jeder Studierende sollte sich seinen eigenen Stundenplan erstellen. Die in den einzelnen Bereichen (Kernbereich, Pflichtbereich, Wahlpflichtteil A und Wahlpflichtteil B) zu belegenden bzw. wählenden Fächer können im Vorlesungsverzeichnis der RWTH Aachen unter www.campus.rwth-aachen.de ausgesucht werden. Die Zahlen in Klammern geben dabei die Semesterwochenstunden an.

Fach	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester
KERNBEREICH				
Prozess- und Werkstoffmodellierung			----- (7)	
Charakterisierungsmethoden Röntgenmethoden I:		----- (2)		
Charakterisierungsmethoden Elektronenmikroskopie II:		----- (2)		
Charakterisierungsmethoden Rastersondenmikroskopie III:		----- (2)		
Charakterisierungsmethoden Dünne Schichten und Magnetooptik IV:		----- (2)		
PFLICHTTEIL				
Rastersondenmikroskopie	----- (3)			
Katalyse in der Technik	----- (2)			
Oberflächentechnik I		----- (7)		
WAHLPFLICHTTEILE				
Wahlpflichtteil A	-----	-----	---- (6-9)	
Wahlpflichtteil B	-----	-----	---- (10)	
Nichttechnisches Wahlpflichtfach	----- (4)			
Studienarbeit			----- (6)	
Seminar		----- (1)		
Masterarbeit				-----
Empfohlene SWS	16	19	17	

Im Wahlpflichtteil A sind Veranstaltungen mit einem Gesamtumfang von 7-8 SWS, im Wahlpflichtteil B Veranstaltungen mit einem Gesamtumfang von 6-7 SWS über die drei Semester zu belegen.